

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850
Fax: (57-1) 544 0880
8880

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

373 +
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-087295- -00009-0000
Fec: 2007-01-10 18:34:19 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Evs: 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Trámite: 002
Evento: 001
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 01087295
Asunto : Solicitud de patente para: **FORMA CRISTALINA DE EPLERENONA**
Solicitante : **PHARMACIA CORPORATION**
Fecha de Solicitud : 10 de octubre de 2001

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 9787 notificado por fijación en lista el 31 de agosto de 2006.

2. Mediante memorial radicado el 22 de noviembre de 2006 solicité plazo adicional de 30 días para responder el oficio No. 9787.

3. Mediante el oficio número 9787 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

4. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio número 9787 de la manera siguiente:

4.1. **Novedad y Nivel Inventivo.**

Inicialmente pongo de presente al Despacho que con el fin de superar las objeciones formuladas en la Acción Oficial, presento un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 29 reivindicaciones.

Adicionalmente, quiero poner de presente que los documentos D1 y D2 son considerados como el arte previo mas cercano a la presente solicitud por lo que lo que procederé a demostrar a

continuación las razones por las cuales los mismos no pueden ser consideradas como anterioridades que puedan afectar su novedad y nivel inventivo.

D1

En relación al documento D1, dicho documento no reconoce que existan múltiples formas en estado sólido de eplerenona, en particular formas anhidras cristalinas de eplerenona. Es más, no existe ninguna forma de caracterizar alguna forma cristalina mediante Ng. Adicionalmente, no existe reconocimiento de propiedades específicas diferentes de formas cristalinas de eplerenona. Específicamente, entre las propiedades que distinguen la forma II de cualquier otra forma cristalina como por ejemplo la forma I es que la forma II exhibe un sistema de cristal monoclinico el cual se caracteriza mediante un patrón de difracción de rayos X a una longitud de onda de 1.54056 Å que comprende uno o más picos que se seleccionan del grupo que consiste de 8.0 grados 2° , 12.4 ± 0.2 grados 2° , 12.8 ± 0.2 grados 2° y 13.3 ± 0.2 grados 2° . En otras palabras, como una persona versada entendería la forma II exhibe un patrón de difracción de rayos X que presenta uno o más picos que se seleccionan del grupo que consiste de 8.0 ± 0.2 grados 2° , 12.4 ± 0.2 grados 2° , 12.8 ± 0.2 grados 2° y 13.3 ± 0.2 grados 2° lo cual es una característica esencial de la forma II de eplerenona de la presente invención.

Por otro lado, D2 se centra sobre la cristalización como una etapa de purificación química y no como una etapa para obtener un polimorfo específico. Adicionalmente este documento no demuestra ningún análisis cristalino en la especificación sino que solo reconoce que existan técnicas de PXRD, IR en estado sólido.

Por otra parte, no existe ninguna sugerencia de que ciertos compuestos isoestructurales se produzcan en el proceso Ng como impurezas debido a la sobre oxidación del compuesto en ester y que su presencia conlleve a la formación de la forma H de eplerenona con un sistema cristal ortorómbico y un patrón de difracción de rayos X con un pico a 12 ± 0.2 grados 2° el cual se debe minimizar con el fin de iniciar la formación de la forma L de eplerenona con un sistema de cristal monoclinico y un patrón de difracción de rayos X con uno o más picos que se seleccionan del grupo que consiste de 8.0 ± 0.2 grados 2° , 12.4 ± 0.2 grados 2° , 12.8 ± 0.2 grados 2° y 13.3 ± 0.2 grados 2° .

Tampoco se revela en D1 que las condiciones particulares del proceso influyen la formación de formas cristalinas específicas de eplerenona. Por otra parte, la presente solicitud revela que condiciones específicas de cristalización afectan la formación del polimorfo (tipo de cristal así

como pureza del cristal). Con respecto a la pureza del cristal la presente invención se relaciona con una pureza entre 90% y 100% la cual no es revelada por D1. en consecuencia, la reivindicación 1 y sus dependientes son nuevas e inventivas sobre la referencia Ng. De hecho, el examinador sugiere que la referencia Ng revela cómo sintetizar la misma composición de eplerenona como en la presente solicitud. Sin embargo dicha afirmación es incorrecta ya que la reivindicación 1 reclama una fase de pureza entre 90% a 100% de forma II.

En particular, en la descripción de la presente solicitud se afirma lo siguiente:

"Para asegurar la preparación de un producto que comprende toda la forma L la eplerenona de partida debe ser de alta pureza. Dicha eplerenona es al menos 90% pura preferiblemente 99% pura. Así, ciertas impurezas en la eplerenona de partida puede afectar el rendimiento y el contenido de la forma L del producto obtenido en el proceso.

La eplerenona cristalizada en esta forma a partir de eplerenona de alta pureza comprende al menos 10% de forma L, preferiblemente 90%.

Adicionalmente, para asegurar la preparación de un producto que comprende una fase pura de forma L, la eplerenona de partida es de alta pureza. Dicha eplerenona es al menos 90% pura y más preferiblemente 99% pura".

Así, es importante que con el fin de preparar la forma II de eplerenona cristalina, el material de partida debe ser de alta pureza. Dicho requerimiento de elevada pureza no se revela en D1. por lo tanto, no existe ninguna enseñanza o sugerencia de que el polimorfo de elevada pureza se hubiera producido en D1.

D2

Con relación al documento D2, este describe una etapa general de cristalización para propósitos de purificación en lugar de los medios para obtener e identificar una forma específica cristalina de eplerenona.

Como bien se indica en la solicitud, la eplerenona puede existir en múltiples formas en estado sólido cada uno de los cuales con específicas propiedades físicas. Sin embargo, D2 no reconoce la existencia de múltiples formas de eplerenona en estado sólido. Tampoco revela que la eplerenona

pueda existir en varias formas amorfas, solvatadas y no solvatadas en estado sólido. Tampoco revela que existan las formas L y H de eplerenona. Tampoco revela la diferencia en cuanto a las propiedades físicas entre esas dos formas cristalinas de eplerenona (la forma L tiene mayor estabilidad termodinámica mientras que la H presenta una mayor tasa de disolución).

De hecho, D2 no revela las condiciones de cristalización utilizadas en la presente invención. Así, como se indica en la presente solicitud, las condiciones específicas de cristalización utilizadas pueden tener un impacto sobre la forma cristalina obtenida. Adicionalmente, D2 no revela ninguno de los métodos para identificar las formas cristalinas como difracción de rayos X o espectroscopia infrarroja, tan solo revela el punto de fusión. Sin embargo, con relación al punto de fusión, D2 ni siquiera revela el método utilizado para llevar a cabo dicha medición.

Adicionalmente, D2 contiene 2 ejemplos que describen la síntesis de eplerenona en adición al ejemplo 2 citado por el Examinador. Los ejemplos 1 y 5 también describen la síntesis de eplerenona. Dichos ejemplos establecen que la eplerenona se deja cristalizar a partir de cloruro de metileno y éter. El punto de fusión del producto resultante se reporta como 239C a 241C que es el mismo reportado para el producto del ejemplo 2.

Por otro lado, los Inventores de D2 publicaron un artículo discutiendo la estructura cristalina de la eplerenona. Dicho artículo reporta los resultados del análisis de un cristal sencillo de eplerenona el cual fue recristalizado a partir de cloruro de metileno/éter. Los datos obtenidos para el cristal de eplerenona se reportan en la tabla 1 de dicho artículo. La siguiente tabla provee una comparación de los datos de la tabla 1 de dicho artículo para el cristal de eplerenona y los datos reportados en la tabla 3ª de la presente solicitud para la forma L de eplerenona.

Parametro	Forma L (Datos Reportados en Table 3A De la presente solicitud	Compuesto 25 (Datos Reportados en Tabla 1 del artículo Helvetica Chemical
Sistema cristalino	Monoclínico	Orthorhombico
Grupo espacial	P21	P212121
A	8.78 Å	8.247 {1}
B	11.14 Å	12.903 { 2 Å.
c	11.06 Å	23.422 {3 Å.

a	90°	—
b	93.52°	--
g	90°	--
z	2	4
Volume eA}	1081.8	2482.5(7
r (calculado)	1.275 g/cmj	1.231/-1.153 g/cm3 (max/min densidad)
R	0.062	0.093

A partir de estos datos es posible concluir que el cristal descrito en el artículo de D2 es diferente de la forma L de eplerenona.

Por otro lado, la síntesis de eplerenona se describe en el esquema 4 de dicho artículo y es básicamente el mismo descrito en D2. Un ejemplo específico se relaciona en la página 583 de este artículo. Aunque este ejemplo establece que la eplerenona se cristalizó a partir de cloruro de metileno/isopropanol se clarifica que la cristalización a partir de estos solventes produjo cristales transparentes ortorombicos (con etanol) los cuales se utilizaron en el análisis de rayos X. la forma cristalina analizada por lo tanto fue la forma cristalina solvatada de eplerenona que contiene eter en lugar de la forma L no solvatada de eplerenona.

Por lo tanto, tal como se establece en el artículo mencionado, la eplerenona cristalizada a partir de cloruro de metileno/eter presenta una estructura cristalina diferente de la estructura cristalina de la forma L de eplerenona. Adicionalmente, el artículo en mención sugiere que la eplerenona cristalizada a partir de cloruro de metileno/éteres es una forma etérea de eplerenona y no una forma cristalina no solvatada de eplerenona.

En conclusión, queda claro que la forma L de eplerenona obtenida en la presente invención es nueva e inventiva frente a la eplerenona conocida en el estado de la técnica.

Así entonces, es claro que las características técnicas de la presente invención no habían sido reveladas en su conjunto por estos documentos y que por ende, no pueden ser citados como anterioridades válidas para afectar su novedad.

De la misma manera, estos documentos tampoco mencionan o sugieren la presente invención de manera que no pueden ser considerados como anterioridades válidas de la presente invención capaz de afectar su nivel inventivo.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que solamente los criterios esgrimidos por el Manual Andino de Patentes para adelantar el examen de nivel inventivo de la invención resultan aceptables, de tal manera cualquier otra consideración a este respecto por fuera del análisis problema solución y de que una anterioridad revele o sugiera la invención, no resultaría pertinente en el presente caso para controvertir el nivel inventivo de la invención.

4.2. Excepciones de patentabilidad y Usos

Con el fin de superar estas objeciones, las reivindicaciones 11 y 12 han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones planteadas por su Despacho a la presente solicitud de patente respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio de protección de patente.

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

- 5.1. Formulario de modificaciones
- 5.2. Recibo de pago por valor de \$99.000
- 5.3. Nuevo capítulo reivindicatorio

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 12482-801-003-1
JDF/JDF/
ID-000129/WPC12482
Cns M-2007-00000211

017



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03**

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: PHARMACIA CORPORATION

Dirección: P.O. Box 5110
Chicago
Illinois 60680
Estados Unidos de América.

Domicilio: Chicago
Illinois 60680
Estados Unidos de América.

Lugar de Constitución: Estado de Delaware,
Estados Unidos de América.

Teléfono: 546 09 70 **Fax:** 547 31 70
E-mail: clientes@camyp.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: Emillo FERRERO

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 **Fax:** 211 86 50

E-mail: cavelier@caveller.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: 438.019 TP 31.929

4

Número de expediente: 01087295

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones. Por lo tanto, solicito que se realice el examen de patentabilidad sobre este nuevo capítulo reivindicatorio.

6

Comprobante de pago No. 07- 1,635 **Fecha:** 10 de enero de 2007

7

Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 99.000

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: EMILIO FERRERO

FIRMA:

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

JDF

1. Una composición farmacéutica en una forma de dosis oral que comprende de aproximadamente 0.5 mg a aproximadamente 1000 mg de eplerenona, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde:
 - (a) La eplerenona presente en la composición tiene una pureza de fase de aproximadamente 90% a aproximadamente 100% de eplerenona cristalina de forma L, y
 - (b) La eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un patrón de difracción en polvos de rayos X en una longitud de onda de 1.54056 Å que comprende uno o más picos que se seleccionan del grupo que consiste de 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ ; en donde la eplerenona cristalina de forma L tiene una estabilidad mayor a una temperatura por debajo de la temperatura de transición enantiotrópica de la eplerenona cristalina de forma L que es mayor que la estabilidad de la eplerenona cristalina de forma H bajo las mismas condiciones.
2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona de la fase es de aproximadamente 95% a aproximadamente 100% de eplerenona cristalina de forma L.
3. La composición de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la eplerenona es sustancialmente pura de fase de eplerenona cristalina de forma L.
4. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición es sustancialmente libre de uno o más de eplerenona cristalina de forma H, eplerenona cristalina solvatada, y eplerenona amorfa.

5. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el balance de la eplerenona consiste de uno o más de (i) eplerenona cristalina de forma H que tiene un sistema de cristal ortorómbico, (ii) una forma cristalina solvatada de eplerenona, y (iii) eplerenona amorfa.

6. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por uno o más parámetros de célula unitaria seleccionada del grupo que consiste de:

(a) Un sistema de cristal monocíclico,

(b) Un grupo de espacio $P2_1$,

(c) Valores de célula a, b y c de aproximadamente 8.78 Å, a aproximadamente 11.14 Å, y aproximadamente 11.08 Å, respectivamente,

(d) Valores de unidad de célula α , β y γ que son de aproximadamente 90° , aproximadamente 93.52° y aproximadamente 90° , respectivamente.

(e) Un volumen de 1081.8 Å,

(f) Un valor Z de 2.

7. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende 2 o más picos que se

seleccionan del grupo que consiste de 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ .

8. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende 3 o más picos que se seleccionan del grupo que consiste de 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ .
9. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende picos en 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ .
10. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un patrón de difracción de polvo de rayos X sin un pico significativo en 12.0 ± 0.2 grados 2θ .
11. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un patrón de difracción de polvo de rayos X sustancialmente como se muestra en la Figura 2.
12. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L caracterizado por un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que comprende una o más bandas de absorción seleccionadas del grupo que consiste de aproximadamente 1655 cm^{-1} y aproximadamente 1724 cm^{-1} .

13. La composición de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que comprende bandas de absorción en aproximadamente 1655 cm^{-1} y aproximadamente 1724 cm^{-1} .
14. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que está sin una banda de absorción significativa en aproximadamente 1399 cm^{-1} o que está sin una banda de absorción significativa en aproximadamente 1739 cm^{-1} .
15. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que está sin una banda de absorción significativa en aproximadamente 1399 cm^{-1} y que está sin una banda de absorción significativa en aproximadamente 1739 cm^{-1} .
16. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier sustancialmente como se muestra en la Figura 36.
17. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por tener un rango de fusión de aproximadamente 223° C a aproximadamente 242° C .

18. La composición de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el rango de fusión de la eplerenona cristalina de forma L se determina por calorimetría de exploración diferencial en un índice de calor de 10°C por minuto.
19. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un termograma de calorimetría de exploración diferencial que tiene una endoterma única que ocurre en un rango de temperatura de aproximadamente 237°C a aproximadamente 242°C .
20. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por un termograma de calorimetría de exploración diferencial sustancialmente como se muestra en la Figura 17.
21. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por uno o más de lo siguiente:
- (a) Un patrón de difracción en polvo de rayos X en una longitud de onda de $1.54056\text{ \AA}$ que comprende picos en 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ ;
 - (b) Un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que comprende bandas de absorción en aproximadamente 1655 cm^{-1} y aproximadamente 1724 cm^{-1} ; y
 - (c) Un termograma de calorimetría de exploración diferencial que tiene una endoterma única que ocurre en un rango de temperatura de aproximadamente 237°C a aproximadamente 242°C .

22. La composición de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por dos o más de lo siguiente:

- (a) Un patrón de difracción en polvo de rayos X en una longitud de onda de 1.54056 Å que comprende picos en 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ ;
- (b) Un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que comprende bandas de absorción en aproximadamente 1655 cm^{-1} y aproximadamente 1724 cm^{-1} ; y
- (c) Un termograma de calorimetría de exploración diferencial que tiene una endoterma única que ocurre en un rango de temperatura de aproximadamente 237°C a aproximadamente 242°C .

23. La composición de acuerdo con la reivindicación 22, en donde la eplerenona cristalina de forma L se caracteriza por:

- (a) Un patrón de difracción en polvo de rayos X en una longitud de onda de 1.54056 Å que comprende picos en 8.0 ± 0.2 grados 2θ , 12.4 ± 0.2 grados 2θ , 12.8 ± 0.2 grados 2θ y 13.3 ± 0.2 grados 2θ ;
- (b) Un espectro de absorción infrarrojo de transformación Fourier que comprende bandas de absorción en aproximadamente 1655 cm^{-1} y aproximadamente 1724 cm^{-1} ; y

(c) Un termograma de calorimetría de exploración diferencial que tiene una endoterma única que ocurre en un rango de temperatura de aproximadamente 237° C a aproximadamente 242° C.

24. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente eplerenona cristalina de forma H, en donde dicha eplerenona cristalina de forma H tiene un sistema de cristal ortorrómbico.

25. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, comprende adicionalmente una forma cristalina solvatada de eplerenona.

26. La composición de acuerdo con la reivindicación 25, en donde dicha forma cristalina solvatada de eplerenona es un solvato cristalino de metiletilcetona de eplerenona.

27. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente eplerenona amorfa.

28. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la forma de dosis oral es una forma de dosis oral sólida que se selecciona del grupo que consiste de tabletas, capsulas y polvos.

29. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la eplerenona cristalina de forma de L comprende un tamaño de partícula D_{90} que varía de aproximadamente 25 micrones a aproximadamente 400 micrones.

15
387

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 1,635
FECHA : ENERO 10 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-087285- -00009-0000
Fec: 2007-01-10 18:34:18 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Evo: 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CANELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	49368280	10/01/2007	57,744,000.

C O N C E P T O

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEYAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO 12482 801 003 1

388

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
N° Radicación	01 087 295	Fecha de presentación	10 - 10 - 2001
N° Prioridad	No Relv Prioridad	Fecha de Prioridad	No Relv Prioridad

Palabras clave	

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA			
A 61 K 31/19	// 31/13		

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	
Otro	

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
OEPM	Epoline	Espacenet	Oficina US

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Documento	Fecha	Relv. Afectada

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento de Patentes	Relv. Afectada	Relevancia
WO 98 25948	1 - 10, 13 - 18	Novedad y Nivel inventivo
US 4 559 332	1 - 10, 13 - 18	Novedad y Nivel inventivo

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relv. Afectada	Relevancia
HISCOX-HOPKINS Gran Enciclopedia Práctica de Recetas Industriales Ediciones G.Gilli S.A. México, 1995.	1 - 10, 13 - 18	Nivel inventivo

Observaciones	

Fecha del examen	Agosto 25 de 2006
------------------	-------------------